

# Effiziente Mikroskopie

## Multi-Sample-Holder (MSH-1)

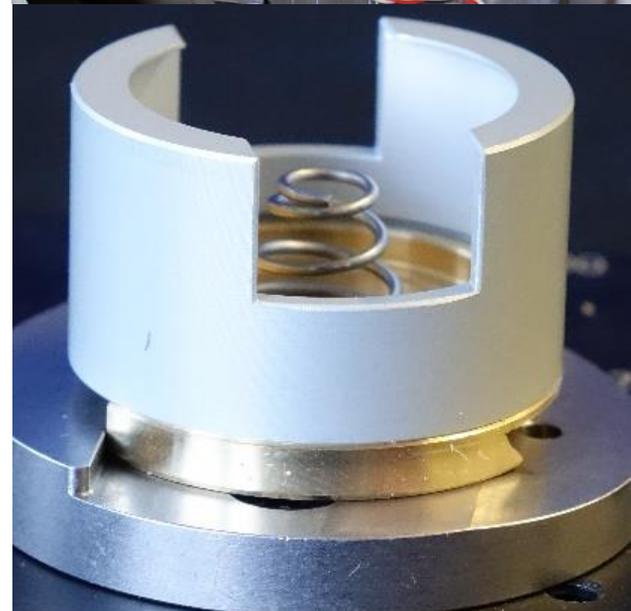
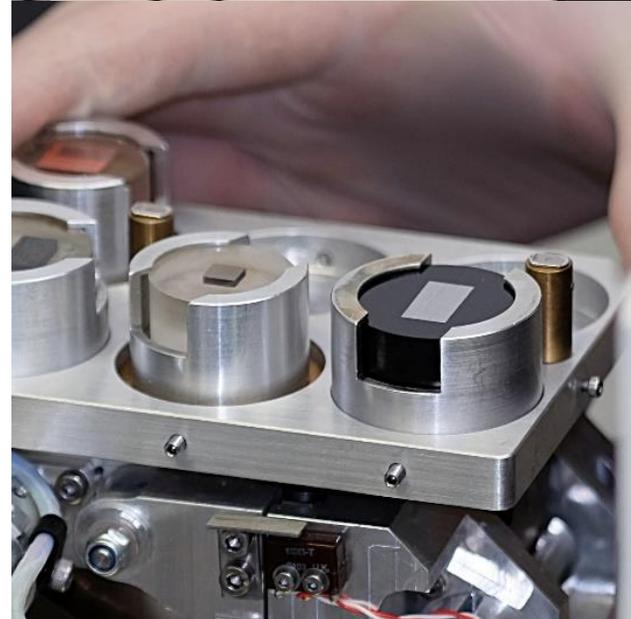
- Bis zu 6 Schliffproben mit  $\varnothing$  25/ 30 mm, Höhe bis 15 mm
- Reproduzierbare Fokusebene mit Koordinatensystem
- Drehfunktion zur Ausrichtung je Schliff
- Hohe Effizienz bei Reihenuntersuchungen
- Flexible Handhabung
- Sputterfähigkeit für REM
- Effiziente korrelative Mikroskopie
- Kompatibilität zu Carl Zeiss Licht- und Rasterelektronenmikroskopen sowie Shuttle&Find

## Komponenten

- Adapterplatte für Aufnahme am Lichtmikroskop
- Grundplatte passend für Lichtmikroskop und REM
- Einzeln zu entnehmende Probenhülsen (auch einzeln als Single-Sample-Holder verwendbar)
- Kalibrationsmarker CorrMic und EDX-Kalibration integriert

## Single-Sample-Holder

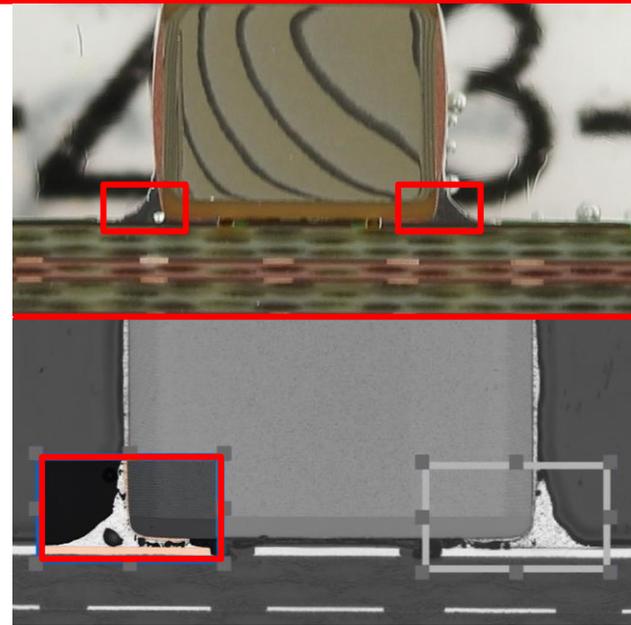
- Reproduzierbare Fokusebene, probenunabhängig
- Individuelle Drehfunktion zur Ausrichtung
- Langzeitstabil – kein Drift durch weichgewordene Knete
- Sputterfähigkeit für REM
- Kein Verrutschen bei schnellen Bewegungen motorisierter Mikroskoptische
- Fixierung durch Schwalbenschwanzführung, aber auch stehfähig auf Mikroskoptisch
- Kompatibel mit Multi-Sample-Holder (MSH-1)



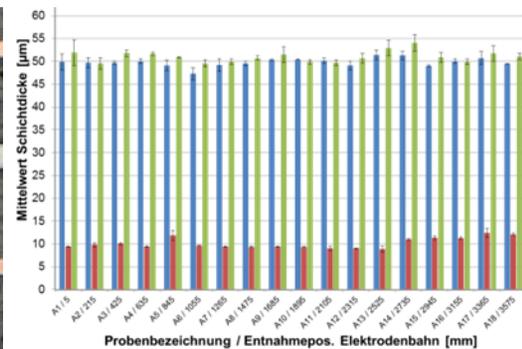
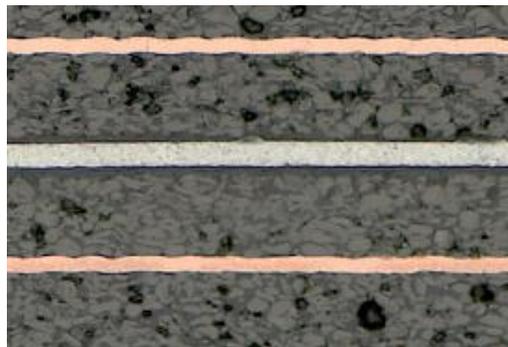
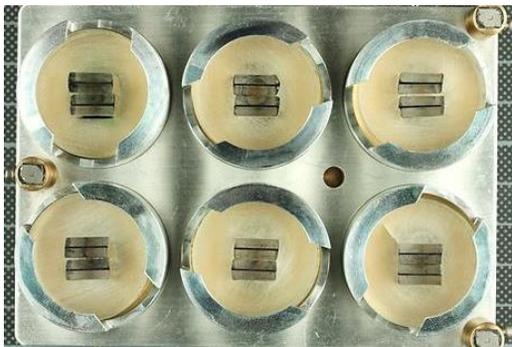
# Effiziente Mikroskopie

## Software AutoSEM

- Unterstützung Multi-Sample-Holder und Carl Zeiss CorrMic-System
- Probenhaltererkennung und Kalibrierung
- Definition der gewünschten Aufnahmepositionen durch interaktives Einzeichnen
- Planung der Bildaufnahme auch im Offline-Modus
- Festlegen der Aufnahmebedingungen
- Verarbeitung von großen Bilddaten
- Hohe Auslastung der Mikroskope möglich
- Standardisierter Workflow von der Mikroskopie bis zur Datenauswertung

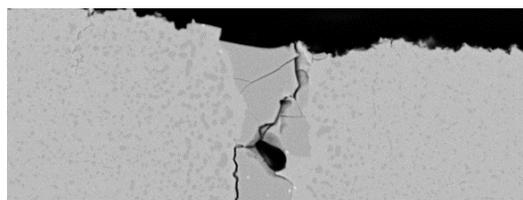


## Einsatzbeispiel Serienanalyse

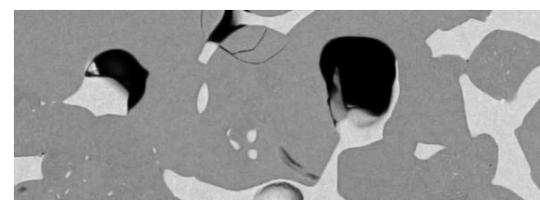


Lichtmikroskopische Schichtdickenanalyse mit statistischer Auswertung

## Einsatzbeispiel Korrelative Mikroskopie



Defekt- oder Einschlussanalyse Stahl: Licht- und Rasterelektronenmikroskop poliert, Lichtmikroskop geätzt



Phasenanalyse Magnet: Hellfeld-, Polarisations- und Rasterelektronenmikroskop